

報道関係 各位

株式会社アドバンテスト

テスト・システム T2000 の新モジュール「8GWGD」を発表

アナログ/ミクスト・シグナル SoC 試験向け新システム

大容量記憶装置や家電製品用 SoC に新たなテスト・ソリューションを提案

株式会社アドバンテスト(本社:東京都千代田区 社長:松野晴夫)は、ハードディスク・ドライブなど大容量記憶装置などに使用される SoC デバイスの試験向けに、テスト・システム「T2000」の新モジュール「8GWGD」(8-Giga-sample-per-second Waveform Generator and 8GHz Digitizer)を発表しました。当モジュールは、2013年7月9日~11日に米国・サンフランシスコにて開催される「Semicon West 2013」に出展する予定です。

アドバンテストのテスト・システムは、世界中の SoC テスト市場における主導的地位を築いています。今回の新モジュール「8GWGD」は、サーバ需要の成長著しいクラウド・コンピューティング向けに、新たなテスト・ソリューションを提案します。「8GWGD」は、既に販売中の「8GDM」(8Gbps Digital Module)を組み合わせることで、大容量記憶装置向け SoC で一般的に用いられる Serdes 等の高速インタフェース回路だけでなく、リードチャンネル・デバイスで必要とされる複雑かつ高速のアナログ信号試験にも対応できます。

「8GWGD」の AWG^{*1} は、PRML^{*2} 波形やマルチトーン波形など、高速サンプリングで、広帯域なアナログ信号出力を可能にする事により、高速アナログ/デジタル・コンバータや、プリアンプなどのアナログ・フロント・エンド・デバイスを試験することができます。さらに、AWG 信号と高精度なタイミング同期が可能な GATE 信号を発生する機能を持ちます。

また、「8GWGD」のデジタイザは、システムのスループット向上と広帯域アナログ測定を可能にします。アイ・ダイアグラム測定や Tr/Tf 測定だけでなく、サイクル間ジッタ、ロングターム・ジッタ測定等のテスト・ソリューションを提供することにより、高速デジタル・インタフェース、PLL^{*3} デバイス、高速デジタル/アナログ・コンバータやプリアンプ・デバイスの試験をすることができます。

*1 AWG Arbitrary Wave Generator: 任意波形発生器

*2 PRML Partial Response Maximum Likelihood: ディスクからノイズが多い歪んだデータを読み取り、エラーなく再生できる信号処理技術の1つ

*3 PLL Phase Locked Loop: 位相同期回路